Se	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/725,554	CHEN, OWEN
Examiner	Art Unit
Anabel M. Ton	2875

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
362	84	10/30/2005	АТ
	27		
	29		
	27		
	276		
	800		
	802		
40	204		

INI	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1		

	DATE	EXMR
	·	
	·	
	,	
·		_
		-